· ⑩ 日本 国 特 許 庁 (J P)

⑪特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭62-11130

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)1月20日

G 01 N 21/67

A-7458-2G

審査請求 未請求 発明の数 2 (全19頁)

液状導電性材料の現場分析 49発明の名称

> 願 昭61-56013 ②特

愛出 頤 昭61(1986)3月13日

砂1985年3月13日砂米国(US)砂711350 優先権主張

マリオ・アンドレス・ ②発明者

アメリカ合衆国ニューハンプシャー州03053, ロンドンデ リー, ウィンターウッド・ドライブ 84

セインズ

アメリカ合衆国ニユージャージー州モーリス・カウンテ アライド・コーポレー ⑪出 願 人 イ, モーリス・タウンシップ, コロンピア・ロード・アン ション

ド・パーク・アベニユー(番地なし)

外5名 恭三 ②代 理 人 弁理士 湯 浅

1. [発明の名称]

液状導電性材料の現場分析

- 2. (特許請求の範囲)
- (1) (a) 内側ハウジングをプローブハウジング内の 選ばれた縦位置に配置し;
- (b) スパーク電極を内側ハウジング内の収縮し た位置に配置し、これによりスパーク包售の放電 部が内側ハウジングの試料採取用末端部から内側 へ第1の選ばれた距離だけ間隔を置いて配置され;
- (c) 液状材料のアリコート試料を、プローブハ ウジングにより定められかつ内側ハウジング試料 採取部およびスパーク電極と流体連絡をもつ試料 採取チェンバー中へ導入し;
- (d) 選ばれた圧力の非反応性ガス雰囲気を試料 採取チェンパー内に与え;
- (4) 上記アリコートの液体自由表面の位置が内 伽ハウジング試料採取用末端部の位置と実質的に 同じである基準液面を検出し、
 - (バ) 上記液体自由表面と内側ハウジング試料採

取用末端部の間の相対距離を変化させ、内側ハウ ジンク試料採取部が液体自由表面から移動して選 はれた分離ギャップ距離だけ間隔を置いて配置さ れた分離位置を確立し;

- (g) スパーク電極を、内側ハウジング内におい て内側ハウジング試料採取用末端部から内側へ選 はれた作動距離だけ間隔を置いた作動位置に配備
- (A) スパーク電極と液体アリコート自由表面の 間でアーク放電し、これにより上記ガス中の上記 材料の粒子からなるエーロゾル試料を生成させ;
- (i) 試料採取チェンパーを質流し、そしてアー ク領域を質流する前記非反応性ガスの流れを与え; そして
- (j) との非反応性ガスおよびエーロゾル試科の 従れを試料採取チェンパーから排出する方向に向 ける

工程からなる、液状海電性材料の試料採取法。

(2) 検出工程(4)が内傷ハウジングの試料採取用末 端部から排出されるガス流の選ばれた停止さたは

特開昭62-11130 (2)

開始を検出する工程からなる、特許請求の処囲第 1項に配載の方法。

- (3) 変化させる工程(J)が、プローブハウジングが 液状物質内で位置する相対深さを減少させる工程 からなる、特許請求の範囲第1項に記載の方法。
- (4) 変化させる工程(が)が試料採取チェンバーに供給される非反応性ガスの圧力を高める工程からなる、特許請求の範囲第1項に記載の方法。
- (5)(a) 非反応性ガスを内包すべく解放された試料 採取チエンバーを定めるプローブハウシング;
- (b) 液状材料のアリコートを試料採取チェンパー中へ導入するための入口手段;
- (d) プロープハウジング内に位置し、これに対し縦方向に移動可能な内側ハウジング;
- (d) 内側ハウジングをプローブハウジングに対し終方向に選択的に配置するためのハウジング調整手段;
- (d) 内側ハウジング内に試料採取チェンバーと 連絡した状態で配置されたスパーク電極であつて、 内側ハウジングに対して縦方向に移動可能であり、

(7) ハウジング調整手段が

- (a) プローブハウジングの末端を通過して伸長することができ、実質的に平行な碑がその円周に 形成された内側ハウジング先端部; ならびに
- (b) プローブハウジングと上記簿の少なくとも 1 個を選択的にはめ合わせて内側ハウジングをプローブハウジングに対して選ばれた実質的に一定 の位置に保持するためのクランプ手段
- からなる、特許請求の範囲第 5.項に記載の試料採取用プロープ。

(8) 電優調整手段が

- (a) スパーク電極に連結され、設定極を内側ハ ウジングに対して殺方向に移動させるべく構成さ れているねじ駆励機構; および
- (b) スパーク電優と内側ハウジングとの相対位 数を指示するための測定手段
- からなる、特許請求の範囲第5項に記数の試料採取用プロープ。
- (9) プローブハウジングが導電性材料から構成されている、特許請求の延囲第5項に記載の試料採

スパーク電極と上記液体 アリコートの自由表而の間でアーク放電し、これにより上記ガス中の上記 材料の粒子からなるエーロゾル試料を生成すべく 栩成された電極;

- (の スパーク電極を内側ハウジングに対し縦方向に選択的に配像して、スパーク電極の放電部を内側ハウジングの試料採取用末端からよりも上記 液体自由表面から選択的に離れて位置させるためのスパーク電極調整手段;
- (g) 選ばれた圧力の上記非反応性ガスの雰囲気を試料採取チェンパー内に与えるためのガス入口 手段; ならびに
- (h) 上記のガスなよびエーロソル試料の流れを 試料採取チェンバーから排出する方向に向けるた めの出口手段

からなる、液状導電性材料を試料採取するための
試料採取用プローブ。

(6) 内側ハウジングがプローブハウジングかよび スパーク電極と実質的に同軸に位置する、特許請求の延囲第5項に記載の試料採取用プローブ。

取用プロープ。

- (11) プローブハウシングが導電性耐熱材から構成されている、特許請求の範囲第5項に記収の試料採取用ブローブ。
- (II) プロープハウジングが炭化ケイ素系耐熱材から構成されている、特許請求の範囲第10項に記載の試料採取用プロープ。
- (12) さらに、プローブハウジングの周囲に位置する、プローブを冷却液流で冷却するための冷却コイルを含む、特許請求の範囲第5項に記載の試料採取用プローブ。

8. 〔発明の詳細な説明〕

本発明は液状導電性材料の構成元素を測定する ための方法かよび装置に関する。より詳細には、 本発明は裕融合金の構成元素の測定に関する。

合金の物理的特性、たとえば強度、硬度、 靱性 シよび耐食性は、一部は金属組成化依存する。 特 にこれらの特性は構成する合金元素の低に依存す ス

合金の組成を御定するためには、一般に쯈融合

特開昭62-11130 (3)

金から液体試料を取出し、固化させ、次いで化学的手段または分光御定手段により分析する。分析によつて正確な組成が示されると、溶脓物を注型して目的の製品を待る。効果的な生産には、迅速かつ正確な分析が要求される。溶脓物中で継続している化学的過程によつて、試料を取出す時点と分析される時点との間で組成が変化する可能性があるからである。時間の隔りが大きすぎると、分析は溶脓物の真の組成を表わさないかも知れない。

容融合金の正確な"実時間(real time)"分析を行うための試みが行われている。米国特許第3.659944号(1972年5月2日にエム・ポンツクに交付)は、容融金属の直接連続分光測定のための装置を開示する。米国特許第3.645.628号(1972年2月29日にエム・ポンツクらに交付)は容融金属の直接分光分析のための装置を提供し、これは使い捨て延長管を偏えた光伝達質を含む。米国特許第3.672.774号(1972年6月27日にポンツクらに交付)は、

を融金属の直接分光測定試験のための委員を提供

を被じる可能性がある。また、電極から浸食された材料が励起された試料からの発光を妨害するので、スパーク発光法はマトリックス効果をも生じる。放出された光は分光計に導かれなければならないので、光は介在する大気中の分子により、また光学システムに用いられる透過ミラーおよびレンズにより散乱、収取する。このためには分光計を密放金属の近くに設置し、また光を導くために特殊な複雑な光学素子を使用しなければならない。

一般に先行技術の装置は溶融金点をサンプリング地点にまでポンプ送りするか、あるいは試料を溶散物表面付近(との場合スラグが分析を妨害する可能性がある)から採取する。このような方法は正確な現場分析を行うのには役立たない。スパーク発光装置も接続の試料をよび分析を妨害する可能性のある強留蒸気を生成し、またこれらの設は溶融物の均衡性を確認するために溶融組成物上の種々の位置をよび溶融物内の種々の深さにおいてデータを得ることができない。

米国特許第3.606.540号(1971年9月

する。

米国特許第3.669.546号(1972年6月 13日にジェイ・エム・フイルロジェットに交付) は、電極と溶融金属の最面との間のスパークによ り生じる光を受信する特殊な光透過蒸鍵を開示す る。この要似は光を最小限の変化において分光写 真手段へ透過する。

しかしこの先行技術のスパーク発光剛定袋健は多くの欠点をもつ。スパークは放射線の多くを吸収するので、スパークは効果的を生じる発光の直線のではない。その結果、生じる発光の直線的なののののののののののののののののののののののののでは、サンプリングした容融物のでなが、対科本体を代表するものでなければかならない点でもない。重要なパラメーターではである。重要なパラメーターではでいます。locirode)である。特にカウンターでは物表面の投例学性状がである。特にカウンターでは物表面の投例学性状がである。特にカウンターでは物表面の投例学性状がである。特にカウンターでは物表面の投例学性状がである。特にカウンターでは物表面のの変質とのギャンプ距離、すない。ギャの情にはないの動的変化は分析の正確度シよび結果の動的変化は分析の正確度シよび結果の動的変化は分析の正確度シよび結果の動的変化は分析の正確度シよび結果の動物ででは分析の正確度シよび結果の

20日にアール・フィ・ウィリアムズらに交付)は溶融金額を徹粒化するためにガス流を用いる。 務状の溶融液額はガス流によつて海管を経てブラズマ分光計へ導かれる。分光計によつて液筋が分析される。 導管外に形成された特殊なガッヤーは液滴を管壁から難しておくためのもので、 ひかしかし カーリアムズ らのアトマイザー型の ここのガスナトマイザーによる 液 協 は一般に で 動力 といって 効果的に 輸送するために は 大きする。 液筋が なお 輸送管法 で 面化し、 管を目詰りさせる 可能性がある。また先きの試料の 残値が 後続試料の分析を妨害する可能性もある。

米国特許第3.602.595号(アール・エル・ダールキスト)は電源の陽極と試料採取すべき材料との間にアークを生じる接置を開示する。とのアータが、材料の液滴を含むエーロゾルを生成させ、とのエーロゾルがガス硬によつて分光分析のために遅ばれる。米国特許第3.685.911号(1972年8月22日にアール・エル・ダール

特開昭62-11130 (4)

キストらに交付)は毛質内に安定なアークプラズマを発生させる装置を提供する。プラズマ中へ将 入された材料は励起されて発光し、これらの発光 光線が分光計によつて分析される。

しかしダールキストにより数示される装置は溶酸した材料の信頼すべき、または一貫して再現性のある分析値を与えることができなかつた。液状溶験物の表面は放立ち、移動するので、スパークによつて分析に十分な量のエーロゾルを一貫して生成するのに必要なスパークギャップを維持するのが困難になる。

に対し縦方向に選択的に配置する。スパーク電極 が内側ハウジング内に配置され、駄料採取チェン パーと連絡している。この世極は内側ハウジング に対し縦方向に移動可能であり、スパーク電極と 上記液体アリコートの自由表面の間でアーク放電 し、これにより上記ガスなよび上記アリコートの 材料の粒子からなるエーロゾル試料を生成すべく 構成されている。スパーク亀極調整手段が、スパ 一ク電極を内側ハウジングに対し縦方向に選択的 に配置して、スパーク電極の放電部を内側ハウジ ングの試料採取用末端部からよりも上記液体自由 表面から離れて位置させる。 ガス入口手段が、選 ばれた圧力の非反応性雰囲気を試料採取チェンパ 一内に与え、内側ハウジングを貫流し、アーク領 城を買流し、そして試科採取チェンパーを貫流す るガスの流れを与える。出口手段が上記のガスお よびエーロゾル試料の流れを試料採取盆から排出 する方向に向ける。

本発明はさらに液状等電性材料を試料採取する ための手段を提供する。この方法は内側ハウジン 光分析のためにエーロゾルを生成するスパーク 袋 は、正確な分析のために十分な 微度の粒子を含むエーロゾルを容融試料から信頼性をもつて生成することができなかつた。 アークは時に分析信号を与えずに液体の移跡 および排除を生じることがあつた。分析信号がある場合、その強度は 経時的に大幅に 変動し、この変動のため分析の精度が 許容できないほど 低下した。 さらに、試料 採取される 液体からの材料がスパーク 電極を 汚染し、その後の分析を 妨げる可能性があつた。

本発明は、液状導電性材料の構成元素を迅速に、 効果的に、かつ正確に削定するための方法をよび 装置を提供する。

一般にとの装敵は、非反応性ガスを内包すべく 構成された試料採取チェンパーを定めるプロープ ハウジング、および液状材料のエリコートを試料 採取チェンパーに導入するための入口手段を含む。 内側ハウジングがプロープハウジング内に位置し、 これに対し級方向に移動可能である。ハウジング 調整手段が内側ハウジングをプロープハウジング

グをプロープハウジング内の選ばれた縦位置に配 置する工程を含む。スパーク電極が内側ハウジン グ内の収縮した位置に配置され、これによりスパ ーク電極の放塩部が内側ハウジングの試料採取用 宋端部から内側へ第1の選ばれた距離だけ間隔を 置いて配置される。液状材料のアリコート試料が、 プロープハウジングにより定められかつ内側ハウ ジング試料採取部およびスパーク電極と流体運絡 をもつ駄料採取チエンパー中へ導入される。選は れた圧力の非反応性ガス雰囲気が試料採取チェン パー内に与えられ、基準液面が検出される。基準 桜面において、上記アリコートの液体目由裂面の 位置は内側ハウジング試料採取用末端部の位置と 実質的に同じである。液体自由表面と内側ハウジ ング試料採取用末端部の間の相対距離を変化させ、 内側ハウジング試料採取部が被体自由表面から移 動して選ばれた分離ギャップだけ間隔を置いて配 置された分階位置を確立する。スパーク電極が内 伽ハウジング内において内伽ハウジング試料採取 用末端部から内側へ選ばれた作動距離だけ間隔を

特開昭 62-11130 (5)

縦方向に移動可能な内側ハウジングにより、内側ハウジングをプローブハウジング末端から内側へ、特定の液体の試料採取に最適な距離を違いた位置に有利に設定しうる。縦方向に移動可能なスパーク電優により、電極が収縮した位置に配置され、これによりプローブが液状材料中へ挿入される際に電極の汚染が最小限に抑えられる。さらに、移動可能なスパーク電優によつて、電優をスパークギャンブ距離に配置するととができ、これは試料採取される個々の液状材料につき最適なものにすることができる。

離れた位置にある分析手段と流体連絡をもつエ

よび励起工程を備えており、従つて妨害するマト リックス効果を敢小限に抑えるととができる。さ らに試料採取工程なよび励起工程の独立した制御 によつて、各工程を最適なものにすることができ る。誘導カップリングしたプラズマにより生じる 放射発光の強度の直線的な動的範囲はスパークに より生じる発光の直線的な筋的範囲よりも著しく 大きいので、本発明は健康を測定しりる有効範囲 がより大きい。また本発明によれは代りにエーロ プル試料を生成し、次いでこれを築れた位置にあ る励起手段へ輸送するととによつて、光を離れた 位置にある分光計へ伝達するために被雑な光学祭 子を使用することが避けられる。エーロゾル試料 は輸送質を目詰りさせることなく数百フィートの 距離を輸送することができ、新たカ試料が先きの 試科により汚染されることは実質上ない。

さらに 本発明は試料採取される液体とスパーク 電磁の間に逸ばれたスパークギャップ距離を与え、 これを維持することができ、かつ アーク領域に翻 御された流盤をよび流速を与えることができる。 一ロゾル発生プローブという配徴は、裕融金属または腐食性液体などの材料中における構成元気材料を提供などの材料中における構成元気材料を用いる調造過程は、分光計むよびコンピとつてとして、動力では、動力では、動力ではできる。そのは、対力では光光のでは、対力では光光のでは、対力では光光のでは、対力では光光のでは、対力では光光のでは、対力では光光のでは、対力では光光のでは、対力では光光のでは、対力では光光のでは、対力では光光のでは、対力では光光のでは、がらになりに、対力では、からになりが、からになりができる。

これらの狭葉により、分光分析器により分析した 際に一貫した高い強度の信号を与えることができ るエーログル試料を信頼性をもつて生成するとい う本発明の可能性が改智される。

本発明は有利には解融物内の逃ばれた深さの位置に配않しうる操作可能な試料採取用プローブを含み、これにより上層のスラグを避けて正確な現場 御定値が待られ、溶融物の組成かよび均質性を 例定することができる。 付随する分光計は光学カップリングを生じることなく 離れた位置に配置することができる。

従つて一般のスパーク発光型およびガスアトマイザー型の装置と比取して本発明は海電性液体(たとえば溶励合金)の現場は科をより効果的化かつより正確に分析する。 徳々の位置から採取した試料は液体の組成および均須性化ついての実時間情報を与え、これによつてこれらの因子をより 厳密に制御することができる。

本発明は、自動合金添加を達成するのに適した.

特開昭 62-11130 (6)

ハートウエア、温度神定のための光学的高温計、ならびにこれらの個々の過程を制御するためのコンピューターハートウエアかよびソフトウェアと組合せた場合、金属製造過程全体を完全に自動ですることができる。本発明により得られる組むび定値を用いて、治金学的派加成分の性質を製造に移動をできる。たとえば傾の製造に戻して、温度かよび組成の組合せ制定に収累がり、80F(Basic Ozypen Furnace、基礎確式を判定するやあいてきる。この方法の確在的利点にはエネルギー、材料かよび労務費の低減が含まれ、一方では同時に製品の品質の改良が保証される。

本発明の好ましい実施懇様に関する下記の詳細な記述および發付の図面を参照すると本発明はより十分に理解され、他の利点も明らかになるである。...

第1図は分光分析システムの略図を示す。 第2図は本発明の装置の略図を示す。

第3図は本発明の現場用プロープの略図を示す。

第12図は調節可能な内側へウジングおよび調節可能なスパーク電燈を備えた本発明のブロープ 形状の縦断面図を示す。

本発明の好ましい実施想様を容融合金の分析に関して記述するが、本発明を用いていかなる導電性液体をも分析できるととは明らかである。たとえば、めつき浴を運続的に監視し、浴中の材料の通切な農医を維持するための添加を行うことができる。またフッ化ナトリウムを用いてポーキサイトを循环してアルミニウムを設造する際にも、ナトリウムとアルミニウムの企適比率を維持するためにスラリーを監視することができる。

図面の第1図については、一般に試料採取手段 1 および分析手段からなる先行技術の分析委員の 略図が示されている。分析手段には励起手段2 お よび検出手段3が含まれる。検出手段3には分光 計4 およびコンピューターデータ処理委員3 0が 含まれる。

試科採取手段1は操作可能を状態でスパーク電 低化接続したスパーク発生手段1を偏えている。 第4図は本発明のプローブの検断面略図を示す。 第5図は他のプローブの断面略図を示す。

第6四はスパークギャップの調節が不適切である状態に関する、時間の関数としての分析器出力 信号強度の代表的プロットを示す。

第7図はスズ(Sn)を含有する溶版物試料に換する、時間の関数としての分析器信号強度(液長303.28 n m)の代表的プロットを示す。

第8図は金(Au)を含有する溶融物に関する、 時間の関数としての信号強度(被長 2 6 7.6 0 n mO の代表的プロントである。

第9図は銅(Cu)を含有する溶融物に関する、時間の関数としての信号強度(放長324.75 nnの)の代表的プロットである。

第10A一10Dは裕敵はんだに含有される4 種の元素に関する、有効設度の関数としての測定 優度の代表的プロントを示す。

第11図はエーロゾル生成スパークに供給された電力の関数としての分析器の留号遊ぼの代表例を示すグラフである。

非反応性ガス、たとえばアルコンガスが加圧されたガスの供給源12から適切な海智9を経て試料5へ導かれ、適切な雰囲気を与える。次いでスパーク発生器7が試料5(海進性材料)と電極46の間でスパーク放電する。スパーク8によつガスを負の粒子が試料から受食されて、アルコンガスが関のエーロゾル試料を生成する。このエーロゾル試料を生成する。このエーロゾル試料を生成する。のエーロゾル試料を生成するであるう。加圧されたアルコンガスが次いで対象による励起および分光計4による調定のために、海智10を経てエーロゾル試料を分析手段へ概送する。

第2図は本発明の袋性の略図を示す。 本発明の各構成製業は先行技術の分析袋はのものに類似するが、ただし本発明の場合スパーク電極 4 6 がプロープ7 1 の内側に入れられ、試料 5 の代わりに 導電性液体からなる試料アリコート 5 0 を用いる。 プロープ手段 7 1 を導電性被状材料(たとえば経 歴金紙 3 6)に挿入して、そのアリコート容積 5 0をプロープ内に定めることができる。非反応

特開昭62-11130 (7)

性ガス(たとえばアルゴンまたはへりウム)が加 圧されたガス供給原12から導管9を経て供給さ れ、アリコート試料上に非反応性ガスの雰囲気を 与える。胸節器90が導世9を通るガスの圧力お よび流量を制御し、モニター88がプロープ71 に与えられる圧力および促逐を監視する。任意の 調節器63は海賀10を通るガスの圧力をよび流 速を制御するととができ、任意のモニター89は プロープ11と励磁器2の間に与えられる圧力を よび流速を監視することができる。本発明の好ま しい観点においては、鼬節器90により選ばれる 操作圧力を決定するために、溶融物の密度および 試科採取の深さが採用される。励磁器2の流速は とのシステムのオリフィスを削限することによつ て、たとえば導管9、プロープ71または導管 10にあるオリフィスを制限することによつて定 められる.

試料採取手段.6 は融食、浸食その他の様式で非 反応性ガス中におけるきわめて御細な粒子のエー ロゾルを生成する。加圧されたガス流によりエー

はプローブ?1から導管10かよび任悪のチエンパー14を経て、高周波発生装住17により駆動される誘導カンブリングされたプラズマトーチ16中へ向けられる。プラズマトーチはエーロゾル試料中の原子を励起して特徴的な発光スペクトル18を放射し、次いでこれが検出手設3によつて検出される。

機出手段3は励起手段2と共に触れた位置にあり、分光計4かよびコンピューターデーク処理手段30からなる。 図示された尖施態様においては、放射線が分光計4の入口スリント20から入り、反射型回折格子22(第1図)により各種スペクトル周波数の放射線は出口スリント24から出て増保装置(たとえば光電子増倍質26、入射スペクトルにより生じる各種信号を増幅する)に入る。増盛された出力信号は積分手段28で積分され、コンピューター30でデータ処理されて、移設物36中の構成元素およびその量の観みを与える。好ましくはコンピューター30は試料採取手段1

ロゾルが配体導管10を経て、離れた位置にある 励起手段2かよび検出手段3からなる分析手段へ 輸送される。励起手段はエーロゾル粒子中の材料 を励起して特徴的な発光スペクトルを生じ、これ が分光計4かよびコンピューター30からなる検 出手段3により分析される。

試料採取手段 6 は、スパーク発生装成 7 かよび これに付照するプロープ内電優 4 6 からなるもの が好ましい。しかし他の手段、たとえばレーザー、イオンビーム、高周波ビーム、マイクロ波ビーム、または超音波装置をどをプロープ 7 1 と共に用いて、フリコート 5 0 中に総められる融度の元条からなる目的のエーロゾル粒子を発生させうること は明らかである。

励起手段.2 はたとえば加熱により粒子を励起し、 粒子からこれに含まれる構成元梁に特徴的な原子 発光スペクトルを放射させる。放出される放射線 (発光スペクトル)の特徴的な周波数により構成 元素が確認され、放射線の強度はその並を示す。 図示された実施態様においては、エーロンル試料

のスパーク強度を制御するためのフィードバック 手段19をも含む。

溶融合金を調製する際には、溶融物の組成を迅速かつ正確に監視することが重要である。溶融物の組成が固体金属の物理的特性、たとえば強度、硬度、観性、耐食性および耐彼労性を実質的に決定するからである。原料を溶融物に導入するのに伴つて、正確な強の合金元名および接種物

(innoculant) を添加して、自的とする裕敝物 組成を維持しなければならない。 従つて、必要な 合金元素および接種物の添加量を決定するために は、裕敐物の正確な分析が必要である。本発明の 現場試料採取用プロープは材料の試料を溶融物中 の種々の位置から迅速かつ効果的に取出すのに特 に好適である。とのプロープは透はれた位置かよ び課さに移動させて一定容積の裕融金換試料を迅 速に採取することができる。

第3回および34回は本発明の試料採取用プローブ(一般に70)をより詳細に示すものであり、 この場合、投いブローブハウジング32が試料採

特開昭 62-11130 (8)

取チエンバー34を定める。導管62、環66、 開口68およびノズル54からなるガス供給手段 がチェンパー 3 4 内に非反応性ガスの雰囲気を与 える。オリフイス40および場合により弁38か らなる入口手段が導電性材料を試料採取チェンパ - へ導入する。ギャップ調整手段、たとえば液面 センサーノ検出器42および操作部92が、被体 の目由表面 5 5 とスパーク電極 4 6 の間の選ばれ たスパークギャップ距離を測定し、選択的に調整 する。電巡46はカウンター電極とも呼ばれる。 圧力調整手段、たとえば弁31は非反応性ガスの 圧力を調整して、スパーク電極 4 6 と液体自由鉄 面55の間に契質的に一定のスパークギャップ距 離76を維持する。スパーク電極46および外側 低極48は、スパーク電極46とここに導入され た容積の導電性材料の自由級面 5 5 の間でアーク・ 放亀すべく構成および配餡されている。とのスパ ークにより、ガス中における上記材料のエーロゾ ル試料が生成する。次いで加圧手段41が、エー ロゾル粒子を液体アリコート50から掃去するの

値?に接続する。

加圧された非反応性ガス、たとえばアルゴン、 へりウムまたはネオンが将貨62を経てハウジン グ32に入り、現66を通過し、次いで開口68 およびノズル54を経てチエンバー34亿入り、 チェンパー34内に非反応性の雰囲気を与える。 ガス出口朔口61の大きさを調整することにより、 また適切な側御手段(たとえば弁31)によつて ガスの圧力を制御することにより、不活性ガスは チエンバー34内の阪面を調節することもできる。 不活性ガスはチエンバー34からオリフィス61 および導質60を経て流出し、次いで弁63によ つて選択的に方向づけられ、導管58を質疑して このシステムをパージするか、あるいは導質10 を其流する。専智60かよび10を縫る方向に向 けられるガス流はエーロゾル試料をチェンパー 34から励起手段2へ移動させるための輸送手段 の一例となる。協合により存在する弁38は裕融 金属がオリフイス 4 0を経てチエンパー 3 4 へ入 るのを制御し、チェンパー34内に配置されたレ

に十分な促連でアーク52領域のガスを移動させ、 流動させる。次いでこの流動ガスがエーロゾル試 料をチエンバー34から分析手段の励起手段2へ 輸送する。次いで分析手段がエーロゾル試料を分 析して、液状海電性材料の補成元素を測定する。

プローブハウジング32は、分析される個々の 液体の温度をよび腐食作用に抵抗性の材料から構 成される。溶放金属用プローブの場合、ハウジン グ32は好きしくは非腐食性の高脚点金属(たと えばステンレス網)または耐熱材料たとえばアル ミナ(AL₁O₃) またはセラミンクスから構成され る。

電力リート級44がハウジング32内へ伸びてスパーク電極46と接続しており、スパーク電極はチェンパー34円の操作可能な位置にある。リート級44は電気絶験体56によつてブローブハウジングから遮断され、外側電極48はそとに含まれる液体と操作可能な電気接点を形成すべく調整されている。そして電電46と48が操作可能な状態で適切なリート級によつてスパーク発生装

ベル校出器はとの中の液面を検出する。しかし好ましくは、液体資流オリフィス 4 U はチェンバー3 4 内の不活性ガスの圧力によつて制御される。

溶放金属中での試料採取換作に際しては、加圧 された非反応性の、または不活性のガスがノズル 54を経てチエンパー34中へ流入し、オリフィ ス40および閉口61の双方を経てチェンパーか ら排出される。最初の高圧ガス流の一撃〔約20 4/分および圧力 4 0 psi (約2.8 kg/cm²)が弁 63によつて導管58を経る方向に向けられ、分 析を妨害する可能性のある残留材料をとのシステ ムからパージする。パージののち、ガス硫は液少 し、弁63によつて導管64を経る方向に向けら れる。プロープ70は頂部のスラグ層37を適過 して潜脚合金36中へ挿入され、適切な位置調整 手段により裕融物中の希望する深さおよび位置に 選択的に配復される。 この位置調整中はガスの氏 力は裕徳物の金属静圧ヘッドを越えるに制節され、 とれにより金銭またはスラグがチェンパー34に 入るのが阻止される。 ブローブ 7 0 が目的に従つ

特開昭 62-11130 (9)

て配償されると、チエンバー34中のガスの圧力 を低下させ、これにより放面下の一定容板の液体 金属がオリフィス40を経てチエンバー34亿入 る。これにより材料のアリコート50がチエンバ - 内に供給される。レベル検出器 4 2 からなるギ ヤップ指示手段が、スパーク電極46と板面55 の間のギャップ距離を定める液面を検出する。通 宜なスパーク開始額面に選した時点でスパーク発 生 装置 7 が約12~17 K V の高い電圧を電極 4 6 と 4 8 の間に与え、電極 4 6 と液体 段面 5 5 の間にアーク52を発生させる(すなわち放電す る)。アーク52は材料をその表面55から浸食 し、これにより不活性ガス中における金属のエー ロゾル試料を生成する。不活性ガス流によりこの エーロゾルがオリフイス61を経て輸送され、導 皆60および10がエーロゾルを励起手段2中の プラスマへ導く。エーロゾルが長距離にわたつて ガス硫により効果的に輸送されるためには、エー ロゾル粒子の寸法は約 0.1 μm以下でなければな

適なものにする。

第5回は特に有利なブローブ形状の断面略図の 代表例を示す。とれは本発明の他の観点である。 ブローブ 7 1 は外側ブローブハウジング 3 2 を含 らない。本発明の方法および装置は、直径約4~ 100nmのエーロゾル粒子を有利に生成する。

特定の励起手段2の要件に調和した注入速度を 得るために特定のガス流速を選ぶ。たとえば励磁 器かよび分光計がヤレル・アッシュ社(マサチュ セッツ州ウエルタム)により製造されるモデル 86-632からなる場合、好ましいガス流速は 約0.6~14/分である。

励起された材料試料からの輻射発光スペクトルは分光計4かよびコンピューター30によりデータ処理され、試料の構成元素かよびその量が測定される。分析の読みは約60秒以内に待られる。好きしくは、コンピューター30はチェンバー34内のスパーク発生装置かよびスパーク開始を制御するフィードバンク信号を与えるペインクにより電極46と表面55の間のスパークギャップ距離を調節して、スパーク52の強度を最

む。これは駄科採取チェンバー34を定め、好ましくは智状、円筒形の形状をもつ。チェンパー34はこれと延絡して配腹されたスパーク(カウンター) 道徳46をもち、非反応性ガスを内包する構造をもつ。ハウジング32の一端に配腹された開口40は導觝性液体36のブリコート32をチェンバー34中へ導入する入口手段を提供する。スパーク電極46は駄料採取チェンバー34と

遅絡をもち、低低46と液体アリコート50の自由製面55の間でアークを発生させる(すなわち放電する)べく配置されている。アークは非反応性ガス中における導性性材料粒子からなるエーロゾル試料を生成する。

内側ハウジング78はブローブハウジング32 内に堅固に固定配置され、ブローブハウジング 32かよびスパーク電性46と実質的に同軸に位 位する。 管状の内側ハウジングは低極46の周囲 に位極し、開放した末端部分94をもち、 これが 試料採取チェンバー34と連絡する。 征気絶縁体 56が低低46をハウジング78から遮断し、こ

特別昭 62-11130 (10)

の電極を内側ハウジングに対して固定された関係 に保持する。内側ハウジング 7 8 は下方へ電極 4 6 よりも一定距離 7 2 だけ アリコート 5 0 に近 接して伸びる。

ガス入口手段は、現状領域86と連絡する海管58からなる。ガス入口手段は逃ばれた圧力の非反応性ガス雰囲気を試料採取チェンバー34内に与え、円側ハウジング78を貫流し、アーク領域84を買流して試料採取チェンバー34に入るガスの流れを生じる。

電を46および内側ハウジング78の特定の配置により、電を46と液体アリコートの自由装面55の間の基準ギャンプ距離72を検出するための正確な指示手段が与えられる。操作に際しては、ガスが内環86に入り、内側ハウジング78および試料採取チェンバー34内に選ばれた圧力を与え、ブロープ71が容融物36中へ挿入される。溶融物中の一定の深さにおいて、液面55が上昇して内側ハウジング末端部分94に接触し、内側ハウジング78からのガス流を遮断するてあろう。

3 6 の密度の関数である。しかし必要な運動量は 当薬者が容易に計算できる。プロープ 7 1 の 進 値 並進運動は、目的とするスパークギャップを設定 するのに必要な厳密なガス圧を検量せずに、有利 にスパークギャップ 7 6 を設定する。本発明の好 ましい実施懇様においては、スパークギャップ 7 6 は 約 3 ~ 5 加である。いずれにしる、プラズ マ 姉 祖 器 により 最 も 安 足 な、利用可能 な 信号 強度 を 与える 最 遊 な スパーク ギャップ 設定は、 採取さ れる 液体の 値 々 の 組成に 依存する で あろう。

フーク領域84のガス流を制御するための流動制御手段は、現86に与えられる調節されたガス 圧、分離ギャップ距離74、ハウジング78中へのガス入口手段の形状、および出口導質60から 排出される際の調節された流逐からなる。これらの残業が一体となつて、エーロゾル粒子を装面 55かよび液体アリコート50から集めて指去するのに十分な流速82を与える。 ガス砒の最初の停止は、電極46と表面55の間のギャップが"不履行(d.faull)ギャップ で距で72に等しいことを示す。ガスの確れが停止する正確な深さは、環86内の圧力かよび溶酸物36の密度の関数である。一定の溶破物(液体)組成については、ガス流の遮断が起こる深さは当薬者が容易に計算でき、流入ガス圧を関節器90で調節することにより変化させうる。

基準ギャンプが検出されると、ギャップ設定手段92が単極46と表面55の距離を基準となる
*不限行"ギャップから、遠ばれたスパークギャップ距離76へ選択的に変化させる。ギャップ設定手段92は、たとえばプローブ71を矢印方向に選択的に上下に移動させる操作破損からなる。ギャップを付加距離74だけ増大させてスパークギャップ76となすために必要な上向きの運動量も、内側ハウジンク78内の圧力かよび活触物

輸送および出口手段は、外環87を経てチェンパー84と連絡する出口導管60からなる。この輸送手段はガス流およびエーロゾル試料を試料採取チェンパー34から排出させる方向へ向ける。 導管10を経由するガス流は、エーロゾルを移動させ、分析手段へ導く。

特開昭 62-11130 (11)

本発明のさらに他の彼点においては、試料採取 チェンバー34内のガス圧がプロープ11を溶膜 物中へ挿入する際に選択的に制御される。 試料採 取チェンバー内の圧力は、プローブ71が移動し て基準ギャップ位置を確立する間は、チエンバー を貫流するガス流を成少させるべく調整される。 弑科採取チェンパーのガス圧を低下させると密触 物中へのガスの吹込みが有利に減少し、試料採取 チェンパー34内における液体材料の動揺および 飛散が少なくなり、プロープをより正確に基準ギ ャップ位置に設定することができる。長期間のス パーク発生および試料採取ののちには、スパーク 陽極が汚染し、異常な蛍のエーロゾル試料を生成 し始める。従つて、分光計による分析信号の強度 も異常になる。陽極の汚染を除去し、信号強度に おける望ましい安定性を回復するためには、プロ ープ11をスパークギャップ設定位置からこれよ りも大きな他の設定位置へ移動させ、陽極からス パークを発生させる。この処置で汚染を効果的に 除去することができる。こののち、プロープ?し

している。電磁46は内側ハウジング78に対し 縦方向に移動可能であり、スパーク電板放電部 120と液体アリコート自由表面の間でアーク放 質すべく構成されている。 これにより、チェンバ - 3 4 に含まれる非反応性ガス中の上記材料の粒 子からなるエーロゾル試料が生成する。スパーク 竜極調整手段、たとえばマイクロメーター型調整 装置106がスパーク電優46を内側ハウジング 78の軸方向長さに沿つて縦方向に選択的に配置 して、電極46の放電部120を内側ハウジング 7 8の試料採取用末端部118からよりも液体自 由表面から雌れた位置に選択的に配慮する。ガス 入口手段、たとえば導管 5 8が送ばれた圧力の非 反応性ガス袋囲気を試料採取チェンバー34内に 与える。ガス入口手段がさられ、内側ハウジング 7 8 を貫旋し、アーク領域を貫旋し、そして試料 採取チェンバー34を真確するガスの旋れを与え る。出口手段、たとえば導管60がガスおよびエ ーロゾル試料の流れをチエンバー34から排出す る方向に向ける。

を目的とするスパークギャップに再設定し、試料採取を再開する。他の方法の場合、プローブに与えられる電力の核性を逆転させ、この変更した電力によりプローブ内でスパークを生じさせることによつて、スパーク陽陽から汚染を除くことができる。この場合、生じる逆方向の電流により汚染が除かれる。

第12図は本発明の他の形態の断面略図を示す。 試料採取用プロープ 71は、その底部選位末端的 180において試料採取チェンパー 34を定める 外側プローブハウジング 32を含む。開口 40からなる入口手段が 数 材料 36の の 内側 い 口 を シング 78が プロート ウジング 20 内内側に位置 アハウジング 32の 内側に位置 アハウジング 5 大 の 内側 い り ジング 支持 点子 12 および C - 保持 表 で の で ロープ い ウ ジング 支持 点子 11 2 および C - 保持 表 で の で の と が 内側 い り ジング 78 を プロープ 102 が 内側 102 が 内側 102 が 内側 200 に で 200 に 200 に

本発明の好ましい形態においては、プローブハウジング32および内側ハウジング78は中空円筒の形状をもつ。さらに、内側ハウジング78はプローブハウジング32およびスパーク電極46と実質的に同軸に位置する。

プローブハウジング32はその确末階部に強固に付着したプローブハウジング支持員子112を含む。支持員子112はプローブキャリャー114に取付けられる構造をもつ。保持装置ばれ機構116が支持員子112を実質的にキャリャー114内に固定した状態に保つ。ハウジング支持員子112に対解またはステンレス網から支持な材料、たとえば黄網またはステンレス網からで支持なれる。管状金属コイル110がハウジング支持とえば水を導通すべく構成されている。冷却で、ストル110はプローブ71内の過度の温度上昇を最小限に抑える。

内側ハウジング78は外側プローブハウジング 32代対し級万向に滑動可能であり、頂部支持部

特開昭 62-11130 (12)

132を含む。これはプローフハウジング支持員子112の末端104を通過して伸投しうる。頂部104はそこに形成された複数の実質的に平行な円周端100をもつ。クランプ手段、たとえばC-保持装置クリップ102がプローブハウジング支持員子と背100のうち少なくとも1個を選択的にはめ合わせて、内側ハウジングをプロープハウンング32に対して選ばれた実質的に一定の位置に保持する。

電極調整手段はねじ駆動機構、たとえばマイクロメーター106を含み、これは電極46をスパークさせるべく接続され、内側ハウジング78の触方向長さに対して機方向に滑動すべく構成されている。側定手段、たとえばデイジタル型表示器108がスパーク電後46と内側ハウジング78の間の相対的な概方向位置を表示する。より詳細には、測定手段は電極スパーク放電部120と内側ハウジング78の試料採取那の間の相対的な概方向分離ギャンプを表示する。

多孔質の、または穿孔をもつ員子122はガス

以下の例は本発明をより十分に理解するために 提示される。本発明の原理を説明するために示さ れた特定の技術、条件、材料、割合、および報告 されたデータは例示であつて、本発明の範囲を限 定するものと解すべきではない。 を通過させることができ、スパーク選極46を内側ハウジング78の中心に保持するのを補助する。本発明の特定の実施態様においては、内側ハウジング78が最上(最も内側)位置にあると、末端部118がプローブハウジング32の開放端40から内側へ約2インチ(約6cm)に位置する。さらにスパーク選極46が最上位置にあると、電極46のスパーク放戦部が内側ハウジング78の開放端118から内側へ約0.75インチ(約2cm)に位置する。

本発明の他の視点においては、プローブハウジング32が導電性の炭化ケイ業系耐熱材から構成される。適切な材料はカンタル・フアーネス・プロダクン(コネチカント州ペセル)から得られる。プローブハウジングが炭化ケイ累から構成される場合、別個の外側電優48を省略できる。炭化ケイ累製プローブハウジング32がスパーク発生装置でより与えられる電源に適切に接続しているならば、これが外側電極として機能しうる。

有利には、本発明の装置は溶融金属の組成を溶

鉄基合金をるつぼで溶融し、成分元素を現場用 プロープで測定した。プロープは中空円筒状の外 側ハウジング、およびこれと同軸に配置された管 状の内側ハウジングから成つていた。スパーク電 優は内側ハウジングと同軸に固定配置され、内側 バウジングの下端を過ぎて下方へ伸びていた。外 個ハウジングはスパーク電板の末端を過ぎて下方 へ伸びていた。この形状は、スパーク電極の末端 と外側ハウジング内へ導入された導電性溶融液の 表面との間のスパークギャップを厳密に設定する 手段を提供しなかつた。加圧された気旋は内側へ ウジングを貨硫し、スパーク電極の末端を通過す る方向に向かつた。加圧されたガス旋は次いで内 側ハウジングと外側ハウジングの間の壌を経て移 **動し、出口から排出され、これによりスパーク電** 極と外側ハウジングの希触金属の自由表面との間 で放電したスパークによつて発生したエーロゾル 粒子を輸送した。プロープを鉄基合金溶融物中へ 下降させ、外側ハウジングの末端の周囲にガスを 抱立たせることによりパージした。次いで、泡立

49 1

特開昭 62-11130 (13)

ちが停止するまでガス圧を低下させると、溶融金 旗のアリコートが外側ハウジング内へ、スパーク 電極の末端よりも若干低い水準にまで流入した。 アリコートと電極の間のスパーク放電により粒子 のエーロゾルが生成し、これは加圧されたガスの 流れにより、誘導カップリングしたアルゴンプラ ズマの方へ掃去された。ブラズマはエーロゾル粒 子を励起して、鉄元素に特徴的な波長3 7 5 nm

第6図は、時間の関数として任意単位 (a. u.) で測定された相対信号強度のプロットの代表例を 示す。一貫した安定な信号強度は維持されなかつ

*∯*ij 2

63.74 重量 # Sn-35.83 Pb-0.2197 Sb-0.0925 Cu-0.0008 Zn-0.0047 Fe からなるはんだをるつぼ内で溶 融した。 第6 図に代表例を示す形状をもつプロープを用いてエーロゾル試料を生成させ、このエーロゾル試料を方ス億により、誘導カップリングし

トの代表例を示す。第9図は、銅元器に特徴的な波長324.75 nm における発光に関する、信号強度対時間のプロットの代表例を示す。数分間という長期間にわたる多重トレースが第9図の定常状態部分に認められた。これらのプロットは本発明の方法および装置を用いて得られた。これらのプロットから本発明の方法および装置がはんだ合金の金および網成分に特徴的な波長において安定な定常状態の信号強度を生じうることが明らかである。

例 5~8

これらの実験中に例2に記載したはんだの個々 の元素成分は下記の範囲内で変化した。

 Sn
 63.74
 74.14
 頭盘

 Pb
 35.82
 24.20
 頭盘

 Cu
 0.2197 1.49
 頭盘

たアルコンプラズマへ輸送した。プラズマがエーロゾル粒子を励起して、はんだの構成元累に特徴的な発光スペクトルを生じた。本発明の方法および装置を用いることにより正確なスパークギャンプが設定され、維持された。

現 7 図は、スズ元素に特徴的な放長 3 0 8.2 8 nm における発光に関する、時間の関数としての信号強度のプロットの代表例を示す。曲線の"開始"部分はスパークにより溶触はんだからエーロゾルが発生し始めるのに伴つて信号強度が増大するのを示す。プロットの"定常状態"部分は、試験分析期間中、信号強度が維持されたことを示す。プロットの"停止"部分は、エーロゾルの発生が停止した時点で信号強度が低下したことを示す。本発明の方法および装置は安定な、実質的に一定の信号強度を維持することができ、これは容易に分析できた。

例 3および4

第8図は、金元紫に特徴的な波長267.60 nm における発光に関する、信号強度対時間のプロッ

Cu 0.0929-0.0629 重量多

測定された設既倒は、内部基準に対する比率を求めることにより定められた。これらの例においては、比率はスズが発する240.82 nm の彼長に関して求められた。内部基準に対する比率を求める方法は、励起された被分析体試料から発生する総信号強度における変動を補償する。この方法は当技術分野で周知である。

∯ 9

第11図はスパーク力の防数としての信号強度 のグラフを示す。溶破はんだ合金の試料中に認め られる例、ビスマス、金、スズおよび鉄元器につ き信号強度を示す。本発明の方法および装置は、

特開昭 62-11130 (14)

信号強度とスパーク力の間でほぼ直線関係を示す 点で有利である。直線関係はスパーク力40~ 80 まにおいて特に明瞭である。

以上、本発明をかなり十分に詳述したが、これ 5 の詳述に固執する必要はなく、各種の変更およ び修正が当業者には自明であり、これらがすべて 特許請求の範囲に定められた本発明の範囲に含ま れることは理解されるであろう。

4. [図面の簡単な説明]

第1図は分光分析システムの略図を示す。

第2図は本発明の装置の略図を示す。

信号強度の代表的プロットを示す。

第3図は本発明の現場用プロープの略図を示す。

第4図は本発明のプロープの経断面略図を示す。

第5図は他のプローブの断面略図を示す。

第6図はスパークギャップの調節が不適切であ る状態に関する、時間の関数としての分析器出力

第7図はスズ (Sn)を含有する溶胶物試料に関 する、時間の選数としての分析器倡号強度(波長 303.28 nm の)代表的プロットを示す。

第8図は金(Au)を含有する密触物に関する、 時間の関数としての信号強度(波長267.60 nm の)の代表的プロットである。

第9図は銅(Cu)を含有する溶散物に関する、 時間の関数としての信号強度(放長324.75 nm の)の代表的プロットである。

第 1 0 A - 1 0 Dは溶励はんだに含有される 4 種の元界に関する、有効缺敗の関数としての測定 誤反の代表的プロットを示す。

第11図はエーロゾル生成スパークに供給され た電力の関数としての分析器の信号強度の代表例 を示すグラフである。

1:試料採取手段; 2:励起手段: 3:検出手段; 4:分光計;

5: 試料; 6: 試料採取手段; 7 : スパーク発生手段; 8 : スパーク;

9、10:導管; 12:ガス供給源:

14: チェンバー; 16: プラズマトーチ: 17:高周波発生装置; 18:発光スペクトル;

19:/フィードバック手段;20:入口スリット(分光計);

22: 反射 拠回折格子; 24: 出口スリット(分光計); 89:モニター; 9 0 : ガス鹄節器;

26:光電子均倍質; 28:械分手段; 92:操作部(ギャップ設定手段);

30:コンピューター; 31:弁; 9 4:内側ハウジング末端;

3 2 : プローフハウジング; 3 4 : 試料採取チエンバー; 100: 構; 102:保持装置继金;

36:溶融物; 37:スラグ焙; 104:頂部; 106: マイクロメーター;

38:弁; 40:オリフィス; 108:ディジタル型表示器;

4 2 : レベル検出器; 110:冷却コイル;

4 4 :リード談; 46:スパーク亚版; 112:プロープハウジング支持員子;

4 8: 外期電極; 50:叔科アリコート; 114:プロープキャリャー; 116:はの機構;

52: アーク; 54:ノズル; 118:試料採取用末端部; 120:放電部;

55:被体目由表面; 56:电线炮铁体; 122:多孔短(穿孔)負子;

5 8 : 海雷; 60:導幣; 130:プロープ末端; 132:頂部支持部。

61: ガス出口閉口; 62:44; 63:弁; 66:垻;

70: ブローブ; 68:劍口;

71:プローブ; 7 2 : 延収ギャップ記録;

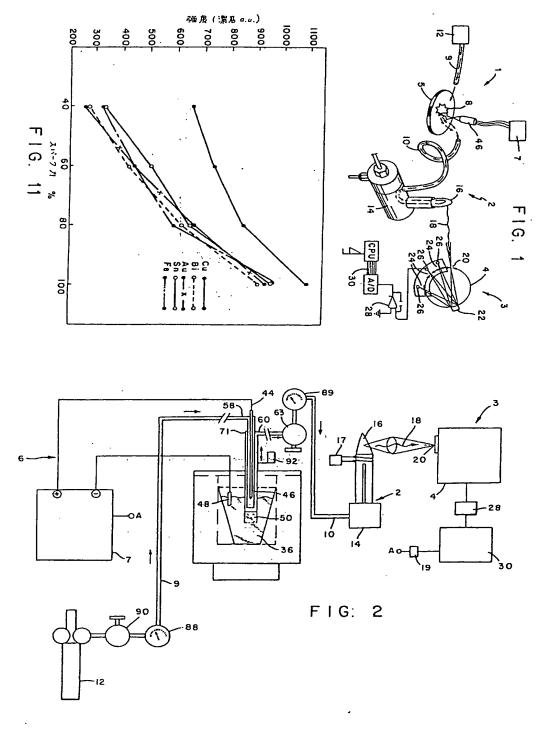
76: ペークギャンプ距離;代 選 人 74:付加此權;

78:内調ハウジング; o2:城運(ガス); (外5名)

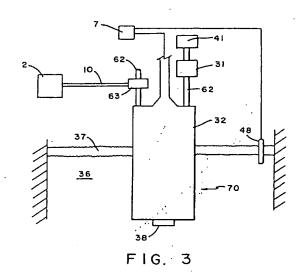
84:アーク領域; 86:門場;

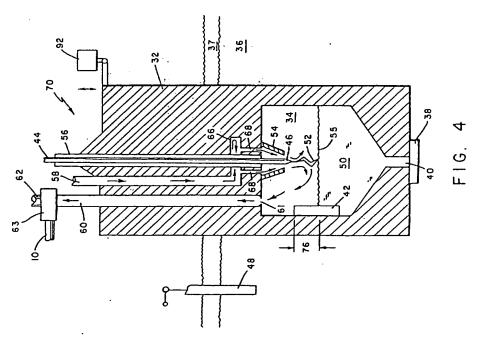
87:外頃; 88:モニター;

特開昭 62-11130 (15)

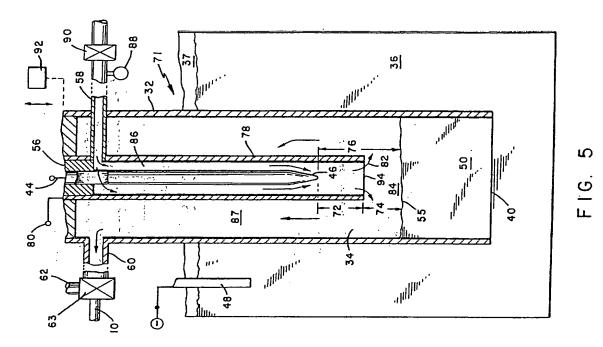


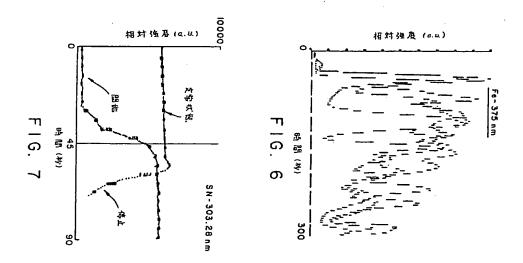
特別昭 62-11130 (16)



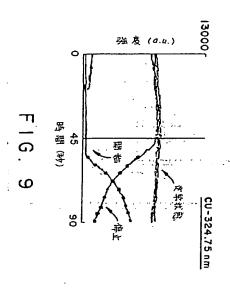


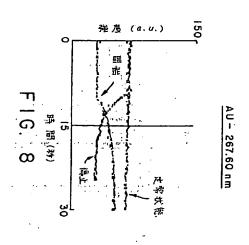
特開昭 62-11130 (17)

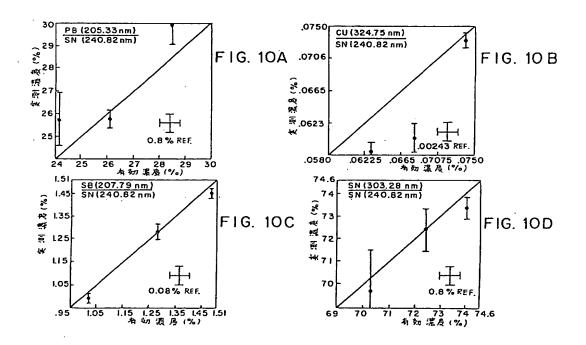




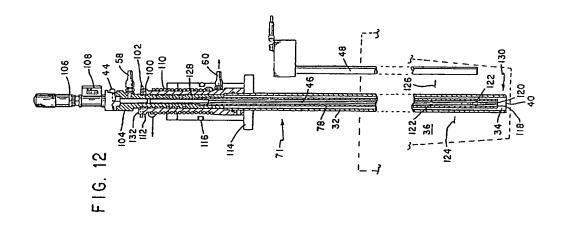
特開昭 62-11130 (18)







特開昭 62-11130 (19)



手 続 補 正 魯(方式)

昭和 61年 8月9日

.特許庁長官 黒田明雄 鄭

1. 事件の表示

園

昭和61年 特許 顯第 56013 号

2. 選頭の名称

液状導電性材料の現場分析

3. 補正をする者

事件との関係 出 願 人

住 所

名 称 アライド・コーポレーション

4.代 理 人

住 所 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル 206号室 -

氏名(2770)并理士 沿 栈 恭 三层科

5. 補正命令の日付 昭和 61年 7月 29日 (発送日)

6.福正の対象

明細客の〔図面の簡単な説明〕の概

7. 補正の内容

1. 明細母第52頁第7~9行に「第10A…… …示す。」とあるのを、次の通りに訂正する。 「第10A図乃至第10D図は溶酸はんだに含 有される4種の元素に関する、有効過度の関数 としての測定過度の代表的プロットを示す。」

2. 同第52頁第12行と第13行との間に下記を抑入する。

『第12図は調節できる内側ハウジングと調節できるスパーク電極を有する本発明のプローブの構造を長さ方向に切断したときの断面図で示した図である。』

以上

61. 8.11